DERWENT-ACC-NO:

2000-630747

DERWENT-WEEK:

200061

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Resin sealed printed circuit board

manufacturing method

involves sealing electronic component and

printed circuit

board by epoxy resin with flux scum

PATENT-ASSIGNEE: FUJI ELECTRIC CO LTD[FJIE]

PRIORITY-DATA: 1999JP-0013807 (January 22, 1999)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 2000216300 A

August 4, 2000

N/A

004

H01L 023/29

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

JP2000216300A

N/A

1999JP-0013807

January 22, 1999

ABSTRACTED-PUB-NO: JP2000216300A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - Electronic components are soldered on glass epoxy laminated sheet

INT-CL (IPC): H01L021/56, H01L023/29, H01L023/31, H05K003/28

used as printed circuit board, by adding epoxy flux blended with dicarboxylic

acid acting as activator, during soldering. The electronic component and

printed circuit board are sealed by epoxy resin with flux scum.

USE - For manufacturing resin sealed printed circuit board soldered with

electronic components e.g. semiconductor chip.

ADVANTAGE - Secures dielectric strength with reliable adhesion strength between

electronic component and PCB by effective resin sealing.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.2/4

TITLE-TERMS: RESIN SEAL PRINT CIRCUIT BOARD MANUFACTURE METHOD SEAL

ELECTRONIC

COMPONENT PRINT CIRCUIT BOARD EPOXY RESIN FLUX SCUM

DERWENT-CLASS: A85 L03 U11

A05-A01E2; A08-D02; A11-B05; A11-C02C; A12-E04; A12-E07A; CPI-CODES:

L03-H04E1;

EPI-CODES: U11-A07;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C2000-189313 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N2000-467526

# (19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(II)特許出願公開番号 特開2000-216300 (P2000-216300A)

(43)公開日 平成12年8月4日(2000.8.4)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
HOIL	23/29		H01L	23/30	R	4M109
	23/31			21/56	R	5 E 3 1 4
	21/56		H05K	3/28	G	5 F 0 6 1
H05K	3/28					
H05K			H05K	3/28	G	5 F U 6 1

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 4 頁)

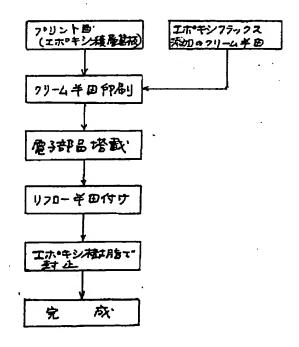
•		香堂南水 木南水 南水坝V数3 UL (主 4 貝
(21)出願番号	<b>特顧平11</b> —13807	(71)出顧人 000005234 富士電機株式会社
(22)出顧日	平成11年1月22日(1999.1.22)	神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号
		(72)発明者 仁科 努 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 1 番 1 号 富士電機株式会社内 (74)代理人 100088339 中理士 篠部 正治 Fターム(参考) 4M109 AM01 BA04 CA21 DB16 EA02 5E314 AA32 BB02 CC17 DD01 FF05 FF21 GC03 CG24 5F061 AM01 BA04 CA21 CB12

### (54) [発明の名称] 樹脂封止形プリント回路板の製造方法

#### (57)【要約】

【課題】プリント基板に電子部品を半田付け実装した後に、フラックス残渣を無洗浄のまま樹脂封止を施して信頼性の高い接着強度、および絶縁耐力が確保できるような製造方法を提供する。

【解決手段】プリント基板に電子部品を搭載して半田付け実装し、その周域を樹脂封止した樹脂封止形プリント回路板の製造方法において、電子部品の半田付け工程では、エボシキ樹脂を主成分としてこれにジカルボン酸(活性剤)を配合したエボシキフラックスを含むクリーム半田を用いて電子部品をプリント基板(ガラスエボシキ積層板が好適)にリフローはんだ付けし、次いでフラックス残渣を無洗浄のままプリント基板、電子部品の周域をエボシキ樹脂で封止する。これにより、フラックス残渣中に残る過剰のジカルボン酸が封止樹脂(エボシキ樹脂)との反応により消費されるのでフラックス残渣の洗浄が不要となる。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】プリント基板に電子部品を搭載して半田付 け実装し、その周域を樹脂封止した樹脂封止形プリント 回路板の製造方法において、電子部品の半田付け工程で は、エポシキ樹脂を主成分としてこれに活性剤を添加し たエポシキフラックスを含むクリーム半田を用いて電子 部品をプリント基板にリフローはんだ付けし、次いでフ ラックス残渣を無洗浄のままプリント基板、電子部品を エポシキ樹脂で封止することを特徴とする樹脂封止形プ リント回路板の製造方法。

【請求項2】請求項1記載の製造方法において、エポシ キフラックスの活性剤としてジカルボン酸を配合したこ とを特徴とする樹脂封止形プリント回路板の製造方法。 【請求項3】請求項1記載の製造方法において、プリン ト基板としてガラスエボシキ積層板を採用したことを特 徴とする樹脂封止形プリント回路板の製造方法。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、樹脂封止形プリン ト回路板の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】まず、本発明の実施対象となる樹脂封止 形プリント回路板の組立構造を図2を援用して説明す る。図において、1はプリント基板(絶縁基板の主面に 導体パターンを形成したもの)、2は半導体チップなど の電子部品、3は電子部品2をプリント基板1に導電接 合した半田、4は封止樹脂である。

【0003】ここで、従来の製造方法では、半田3とし て半田粉にロジン系フラックス(ロジンにアルコールな などを加えたもの)を添加したペースト状のクリーム半 田を採用し、プリント基板1の部品実装位置にクリーム 半田を印刷して電子部品2を搭載した後に、リフロー炉 に搬入してリフロー半田付けを行う。次に、部品実装済 みのプリント基板1を洗浄工程に移し、半田付け工程で 半田3の表面に残ったロジン系のフラックス残渣を有機 溶剤で洗浄する。その後にプリント基板 1 を樹脂封止工 程に移し、モールド形成法によりプリント基板1.電子 部品2の周域を封止樹脂(例えばエポシキ樹脂)4で封 止して樹脂封止形プリント回路板が完成する。

# [0004]

【発明が解決しようとする課題】前記のように半田のフ ラックスにロジン系フラックスを用いて電子部品2をプ リント基板1に半田付けすると、半田付け後には半田3 の表面に余剰のロジン系フラックス残渣が残る。ここ で、フラックス残渣を洗浄しないままでプリント基板1 を樹脂封止すると、樹脂封止後の状態ではフラックス残 渣が封止樹脂4との接着性を阻害し、このために十分な 接着強度が確保できないのみならず、電気的な絶縁性に も悪影響を及ぼすようになる。

【0005】すなわち、図3はロジン系フラックス残渣 の付着量と封止樹脂の接着強度(引張せん断接着強度) との関係を表す図、図4はロジン系フラックス残渣の付 着量とAC耐電圧(絶縁破壊電圧)との関係を表す図で あり、図3,図4から判るようにロジン系フラックス残 渣の付着量がO.1mg/cm 2を超えると接着強度、および AC耐電圧が急激に低下するようになる。

【0006】そこで、従来では電子部品2を半田付けし た後にプリント基板1を洗浄してフラックス残渣の付着 10 残量が0.1mg/cm 2以下となるように管理して品質確保 を図るようにしているが、プリント回路板の部品実装ラ インに洗浄工程を組み入れることは組立工程が増してコ スト高となるほか、洗浄のばらつきによっては製品の信 頼性低下を来すこともある。

【0007】本発明は上記の点に鑑みなされたものであ り、その目的は前記課題を解決し、電子部品の半田付け 後に、フラックス残渣を無洗浄のままで樹脂封止を施し て信頼性の高い接着強度、および絶縁耐力が確保できる ように改良した樹脂封止形プリント回路板の製造方法を 20 提供することにある。

[8000]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明によれば、プリント基板に電子部品を搭載し て半田付け実装し、その周域を樹脂封止した樹脂封止形 プリント回路板の製造方法において、電子部品の半田付 け工程で、エポシキ樹脂を主成分としてこれに活性剤を 添加したエポシキフラックスを含むクリーム半田を用い て電子部品をプリント基板にリフローはんだ付けし、フ ラックス残渣を無洗浄のままプリント基板、電子部品を どの溶剤、活性剤としてのハロゲン塩、およびチクソ剤 30 エボシキ樹脂で封止する(請求項1)ものとし、具体的 には次記のような態様で実現する。

> 【0009】(1) エポシキフラックスの活性剤として、 エポシキ樹脂の硬化剤に使用されるジカルボン酸を配合 する(請求項2)。

> (2) プリント基板としてガラスエポシキ積層板を採用す る(請求項3)。

【0010】上記の方法において、エポシキフラックス の反応温度は半田の溶融温度よりも低く、電子部品のリ フロー半田付け工程では半田が溶融する以前に先ずエボ 40 シキフラックスの反応が始まり、その活性剤であるジカ ルボン酸が半田接合面を清浄にする。続いて加熱温度の 上昇により半田が溶融して電子部品とプリント基板の導 体パターンとの間が半田付けされる。また、この間にも エポシキフラックスの反応が進行してエポシキフラック スの主成分であるエポシキ樹脂が活性剤であるジカルボ ン酸 (エポシキ樹脂の硬化剤でもある) との硬化反応が 進み、半田付けの終了とほぼ同じくらいに反応が終了 し、硬化したエポシキ樹脂が半田付け箇所を覆ってその 接合部を補強するようになる。なお、リフロー半田付け 50 後の状態では、プリント基板上における半田付け箇所に

過剰なジカルボン酸を含むエポシキフラックスの残渣が 残存する。

【0011】次いで、プリント基板を無洗浄のままその 周域をエポシキ樹脂で封止すると、フラックス残渣に含まれている過剰のジカルボン酸(活性剤)と封止樹脂であるエポシキ樹脂とが硬化反応し、この硬化反応によりジカルボン酸が殆ど消費されてその腐食性が低減するとともに、エポシキフラックスの主成分であるエポシキ樹脂と封止樹脂のエポシキ樹脂とが強固に接着し合う。また、この場合にプリント基板にガラスエポシキ積層基板 10を採用すれば、前記と同様にプリント基板のエポシキ樹脂成分とエポシキフラックス残渣とが強固に接着し合う。その結果、プリント基板を無洗浄(洗浄工程不要)のままでも、エポシキフラックスの残渣と封止樹脂、プリント基板との間で高い接着強度が確保でき、かつプリント回路板の絶縁耐力も確保できるようになる。

#### [0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図示の実施例に基づいて説明する。なお、図1は本発明によるアリント回路板の租立工程を表す図、図2はアリント回路板の租立構造図である。

【0013】すなわち、この実施例においては、プリント基板1としてガラスエボシキ積層板を採用するとともに、該基板に電子部品2を導電接合する半田3として、エボシキ樹脂を主成分としてこれに活性剤としてジカルボン酸を配合したエボシキフラックスを含むペースト状のクリーム半田を用い、このクリーム半田をプリント基板1に印刷した後に電子部品2を搭載してリフローはんだ付けを行う。次に、フラックス残渣を無洗浄のまま、プリント基板1、電子部品2の周域をエボシキ樹脂(封 30 止樹脂4)で封止してプリント回路板が完成する。

【0014】ここで、前記のクリーム半田としては、例えばエポシキ樹脂:79%,ジカルボン酸:16%,チクソ剤:<5%の成分からなるエポシキフラックス系のクリーム半田(例えば、Sn63/Pb37のクリーム半田Alpha AP4000(Alpha Metal社製)を採用するものとする。

【0015】なお、前記実施例の方法で組立てたプリント回路板について、その封止樹脂の接着強度を調べたところ、半田付け後にロジン系フラックス残渣を洗浄して

樹脂封止を行った従来製品と同等の接着強度を確保できることが確認されている。また、実施例の方法で組立てたプリント回路板、および従来のプリント回路板を供試試料として、テストにより絶縁耐力を検証したところ、次記の表で表すように明らかに絶縁耐力の改善が確認された。

4

# [0016]

#### 【表1】

	従来品	奥施例
部分放電消滅電圧	2. 5 k V	>6 k V
AC耐電圧	1 0 k V	1 2 k V

#### [0017]

【発明の効果】以上述べたように、本発明の製造方法によれば、プリント回路板の組立工程で、電子部品を半田付け実装した後のフラックス残渣の洗浄工程を省略することができ、これにより従来方法と比べて組立工程の削減化、並びにコストの低減化が図れる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例によるプリント回路板の組立工 程図

【図2】図1の製造方法によるプリント基板回路板の組 立構造を表す断面図

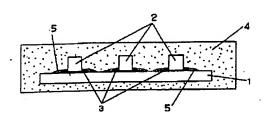
【図3】電子部品の半田付け工程でロジン系フラックス を用いた従来方法におけるフラックス残渣の付着量と封 止樹脂の接着強度との関係を表す図

【図4】電子部品の半田付け工程でロジン系フラックス を用いた従来方法におけるフラックス残渣の付着量とプリント回路板のAC破壊電圧との関係を表す図

#### 【符号の説明】

- 1 プリント基板
- 2 電子部品
- 3 半田
- 4 封止樹脂
- 5 フラックス残渣

【図2】



【図3】

